

ใจเพชรแก้ว โภคา : การปลูกฟิล์มบางซิงค์ออกไซด์ที่เติมสารเจือด้วยกระบวนการผลิต
ต้นทุนต่ำสำหรับชั้นป้องกันสะท้อนแสงของเซลล์แสงอาทิตย์(DEPOSITION OF DOPED
ZINC OXIDE THIN FILMS BY A LOW-COST TECHNIQUE FOR ANTI-
REFLECTION COATING IN SOLAR CELLS)อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ทิพย์วรรณ พิงสุวรรณรักษ์, 110หน้า.

ชั้นป้องกันการสะท้อนแสงสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์มีความสำคัญในการลดความสูญเสีย
ทางแสงที่เกิดจากการสะท้อนกลับที่ผิวของเซลล์แสงอาทิตย์ การสร้างชั้นป้องกันการสะท้อนแสงมี
ส่วนสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานให้แก่เซลล์แสงอาทิตย์เนื่องจากจะมี
ปริมาณโฟตอนมากขึ้นทั้งความยาวคลื่นสั้นและคลื่นยาวนั้น ที่สามารถหักเหและถูกดูดกลืนไปยังที่
ผิวชั้นต้นและลึกได้ตามลำดับในกรณีที่ชั้นป้องกันการสะท้อนแสงที่เคลือบบนผิวเซลล์มีโครงสร้าง
ผิวขรุขระจะยังสามารถทำหน้าที่เป็นตัวกับดักแสง (Light-trapping) ให้กับเซลล์แสงอาทิตย์ได้
เนื่องจากมีพื้นที่รับแสงมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เซลล์แสงอาทิตย์มีกระแสลัดวงจรและแรงดันไฟฟ้า
เปิดวงจรสูงขึ้น

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาและผลิตฟิล์มบางผลึกนาโนซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยบิสมัทที่ผลิต
ด้วยเทคนิคการเคลือบผิวด้วยแรงหมุนเหวี่ยง (Spin coating) จากการเตรียมสารละลายโซล-เจล
(Sol-gel)ซิงค์ออกไซด์ตั้งต้น สำหรับเป็นชั้นป้องกันการสะท้อนแสงให้กับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด
ผลึกซิงค์ออกไซด์ เทคนิคการผลิตดังกล่าวมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าชั้นซิงค์ออกไซด์ที่ผลิตในระบบพ
ลาสมาและสุญญากาศพิเศษ อีกทั้งเทคนิคโซล-เจลยังให้โครงสร้างผิวขรุขระในระดับจุลภาคซึ่งทำ
หน้าที่เป็นตัวกับดักแสงมากขึ้น อีกทั้งค่าช่องว่างพลังงานทางแสงของฟิล์มผลึกบางนาโนซิงค์ออก
ไซด์ที่เจือด้วยบิสมัทมีค่าประมาณ 3.33-3.35eV ซึ่งสามารถผลิตพาหะให้แก่เซลล์จากแสงโฟตอนที่
ตกกระทบในช่วงความยาวคลื่นสั้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาถึงการปรับปรุงโครงสร้างผลึกนา
โนซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยบิสมัทโดยการลดจุดบกพร่อง (Defect) ที่เกิดขึ้นจากการเติมสารเจือด้วย
บิสมัทด้วยวิธีฟอร์มมิ่งแก๊ส (Forming gas) และปรับปรุงคุณภาพพื้นผิวของฟิล์มบางด้วยการเติมสาร
ลดแรงตึงผิวชนิดประจุบวกไตรเมทิลแอมโมเนียมโบไมด์ (CTAB) เพื่อช่วยในการยึดเกาะโมเลกุล
ของซิงค์ออกไซด์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผิวฟิล์มบางและสมบัติทางไฟฟ้าและทางแสงภายใต้
การเติมสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุบวกในปริมาณที่เหมาะสม อีกทั้งในงานวิจัยได้นำชั้นป้องกัน
การสะท้อนแสงจากฟิล์มบางผลึกนาโนซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยบิสมัทซึ่งมีค่าการทะลุผ่านของแสง
มากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์โดยใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ผลึกซิงค์ออกไซด์โครงสร้างรอยต่อพี-เอ็น มีชั้นเอ็น
เป็นชั้นรับแสงซึ่งผลิตด้วยวิธี Spin on doping (SOD) ร่วมกับเทคนิคการหมุนเหวี่ยงของสารละลาย
ที่ลดการฟุ้งพาเทคโนโลยีสุญญากาศ ส่งผลให้เซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้ มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำและให้

ค่ากระแสลัดวงจรเท่ากับ25.81mA และแรงดันไฟฟ้าเปิดวงจรเท่ากับ601.3 mV ทำให้ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์อยู่ที่ประมาณ12.23% ภายใต้การทดสอบด้วยแบบจำลอง PC1D



สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ปีการศึกษา 2557

ลายมือชื่อนักศึกษา _____

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา _____

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม _____

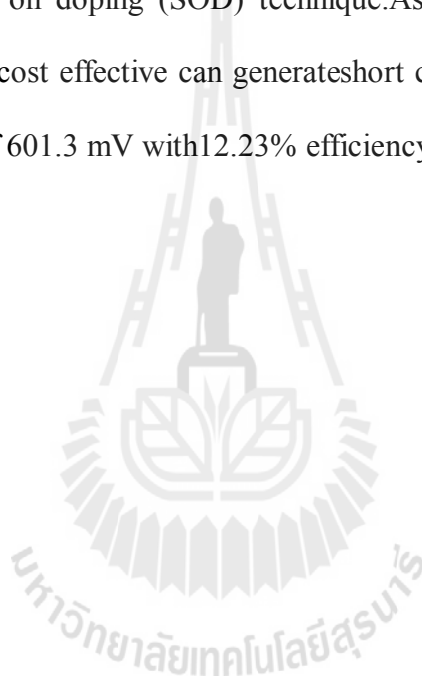
JAIPET KAEWPHOKA: DEPOSITION OF DOPED ZINC OXIDE THIN FILMS BY A LOW-COST TECHNIQUE FOR ANTI-REFLECTION COATING IN SOLAR CELLS. THESIS ADVISOR: ASST. PROF. THIPWAN FANGSUWANNARAK, Ph.D., 110 PP.

SURFACTANT/BISMUTH DOPED ZINC OXIDE THIN FILMS/SOLAR CELL

Antireflection coating (ARC) for solar cells is important in order to reduce the loss of the light caused by reflections on the surface. Preparation of the ARC is important to increase the energy conversion efficiency of the solar cell since there are many photons of short and long wavelength able to both reflect and absorb into the shallow and deep, respectively. In the case of the ARC layer coated on the surface with roughness surface induces as a light-trapping of solar cells because of more exposure. As a result, the solar cell has high short circuit current and open circuit voltage.

This research was studied in the fabrication of Bismuth doped ZnO thin films based on nanocrystalline (ZnO:Bi) structure by using a spin coating technique. The precursor of the sol-gel for the ZnO:Bi layer was investigated to be an ARC layer of the silicon solar cells. The sol-gel preparation is a low-cost technique as compared Plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD) in the plasma and vacuum condition. Moreover, the sol-gel technique provided a roughness surface structure which contributed the increase of light-trapping area. The optical energy band gap of ZnO:Bi thin films was approximately 3.33-3.35 eV by the estimation of Tauc plot that related with UV response. Therefore, This study aims to improve the ZnO:Bi nanocrystalline with reducing defects in Bi doped ZnO by annealing process

underforming gas. Meanwhile, the surface quality of ZnO:Bi thin films was obtained due to surfactant addition of cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) in order to improve molecule adhesion of zinc oxide. CTAB addition and forming gas procedures can affect to the quality of morphology, optical and electrical properties of the thin films. Moreover, ZnO:Bi thin films with transmittance above 95% were used as a function of ARC layer of crystalline silicon solar cell with using n-emitter layer from non-vacuum spin on doping (SOD) technique. As a result, the solar cells with ZnO:Bi layer that are cost effective can generate short circuit current of 25.81 mA and open circuit voltage of 601.3 mV with 12.23% efficiency under PC1D simulation.



School of Electrical Engineering

Academic Year 2014

Student's Signature _____

Advisor's Signature _____

Co-Advisor's Signature _____